

PAT-NO: JP358060559A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58060559 A  
TITLE: MULTICHIP PACKAGE  
PUBN-DATE: April 11, 1983

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME  
YOSHIHARA, KUNIO

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TOSHIBA CORP.	N/A

APPL-NO: JP56158226

APPL-DATE: October 6, 1981

INT-CL (IPC): H01L021/82, H01L027/04

US-CL-CURRENT: 257/E21.602, 361/683

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a multichip package whose internal connections are switchable electrically, while unnecessarily the replacement thereof, by a method wherein input-output signal lines selecting a plurality of electronic function elements of the same kind are switched to each other or to a specified element.

CONSTITUTION: Address data lines which are common input-output lines for signal lines other than a chip enable CE being a signal line for selection of

memory cells  $M<SB>1$ ~ $M<SB>n$ , are connected commonly, while CE alone is decoded for selecting each memory cell.  $M<SB>0$  is an extra redundant memory cell for constituting this memory module, and address lines  $A<SB>o$ ~ $A<SB>i$ , data lines  $D<SB>1$ ~ $D<SB>j$ , a write enable WE, and an output enable OE are connected commonly with remaining memory cells  $M<SB>1$ ~ $M<SB>n$ , while only the chip enable CE, which is a redundant memory cell, is made switchable to any one of CEs of  $M<SB>1$ ~ $M<SB>n$ . Thereby any faulty chip can be switched electrically with ease. A pad SW for switching is usually connected to  $C<SB>0$  and led outside as  $CE<SB>0$ , whereby the operation of the redundant memory  $M<SB>0$  can be checked.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio

機械的衝撃などによって正常な部分を不良にしてしまう確率も高い。また、A/D又はD/Aコンバータなどのアナログ素子では、一般に、アナログ素子の性能を示す指標の一つである直線性の個体差が大きく、アナログ素子を複数個実装した配線基板では、そのアナログ素子が動作可能であるにもかかわらず、直線性の仕様を満足できない為に、不良素子として交換せざるを得ない割合は、求め直線性によっては、非常に大きなものとなる。従って、実装後の性能と価格は、実装前の素子の性能分布によって事实上制約されている。

本発明の目的は、上記の技術の欠点を除去し、電子的機能素子の交換を不要にする、電気的に内部接続切替可能なマルチ・チップ・パッケージを提供することにある。

本発明は、配線基板上に実装されている同一種類で複数の電子的機能素子を選択する入出力信号線を相互に、若しくは特定の電子的機能素子と切替えることを特徴としたマルチ・チップ・パッケージである。

のみならず、配線基板上のすべてのメモリ素子の電子的機能をテストした後、そのテストデータにもとづきパッケージ全体の価値が最も高くなるようメモリ素子の切替ができる。尚第1図において、Dはアドレスデコーダ、DI/Oはデコーダ入出力線である。

本発明の他の一実施例として第2図に示す。デジタル入力ラッチ型D/Aコンバータ素子を複数個D/A<sub>1</sub>～D/A<sub>n</sub>、同一配線基板上に実装し、デジタル入力DI<sub>1</sub>～DI<sub>j</sub>及びストローブ信号Sを共通に接続する。おのののD/Aコンバータ素子を選択するチップ・セレクトCSは相互に切替えられるように配線用パッドを用意しておく。同様に、おのののD/Aコンバータ素子のアナログ出力も、配線基板の任意の出力リードOLへ接続できるよう配線されている。この方法により、配線基板上のすべてのD/Aコンバータ素子は、その直線性の値によって任意のチャンネルへ割付けることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

一つの具体例において、本発明は第1図に示すように同一に接続されるべきアドレス線A<sub>0</sub>～A<sub>i</sub>、データ線をもつての電子的機能素子であるところのメモリー素子M<sub>1</sub>～M<sub>n</sub>で構成されたメモリモジュールに用いられる。このメモリモジュールでは、メモリ素子M<sub>1</sub>～M<sub>n</sub>の選択用信号線であるチップイネーブルCE以外の共通の入出力線であるアドレス・データ各線は共通に接続し、CEのみをデコードして各メモリー素子を選択している。M<sub>0</sub>はこのメモリモジュールを構成するには余分の冗長メモリ素子であり、アドレス線A<sub>0</sub>～A<sub>i</sub>、データ線D<sub>1</sub>～D<sub>j</sub>、ライトキープルWE、アウトプットキープルOEを取りのメモリ素子M<sub>1</sub>～M<sub>n</sub>と共通に接続し、冗長メモリ素子のチップイネーブルCEのみを、M<sub>1</sub>～M<sub>n</sub>のCEの任意の一つと切替えられるようにより、容易に不良チップの電気的切替えが可能となる。通常は切替え用パッドSWをC<sub>0</sub>に接続し、CE<sub>0</sub>として外部へ取出しておくことにより、冗長メモリ素子M<sub>0</sub>の動作確認を行なうことができる。つまり、単に不良メモリ素子を除去す

第1図は本発明の一実施例を説明するためのマルチ・チップ・パッケージの平面図、第2図は本発明の他の実施例を説明するためのマルチ・チップ・パッケージの平面図である。

D：アドレスデコーダ、A<sub>0</sub>～A<sub>i</sub>：アドレス線、D<sub>1</sub>～D<sub>j</sub>：データ線、WE：ライトキープル、M<sub>1</sub>～M<sub>n</sub>：メモリ素子、M<sub>0</sub>：冗長メモリ素子、OE：アウトプットキープル。

代理人 井理士 則近憲佑  
(ほか1名)

BEST AVAILABLE COPY